



X-ray Fluorescence Analyzer

XRF Analyzer EA1200VX



HITACHI
Inspire the Next

توضیحات دستگاه فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX

دستگاه طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس (X-RAY Fluorescence Spectroscopy) ساخت شرکت HITACHI ابزار کاملی است که از آن جهت بررسی عناصر و مواد مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. در دستگاه طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس، اشعه ایکس به نمونه می تابد و در اثر برانگیختن اتم ها و انتقال الکترونی در لایه های مختلف اتم، اشعه ایکس تولید می شود که با تعیین طول موج یا انرژی اشعه ایکس ثانویه که مشخصه اتم است، می توان عناصر موجود در نمونه مورد نظر را شناسایی کرد. دستگاه آنالیز فلورسانس اشعه ایکس مدل EA1200VX یک دستگاه مطمئن در هر آزمایشگاهی برای انجام آنالیز است و بسیاری از نیازها را بر طرف می کند. دستگاه آنالیز طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX با کاهش زمان اندازه گیری به میزان یک سوم نسبت به مدل قبلی بهتر است. همچنین نرم افزار کنترل دقت دستگاه طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX که برای مدل های قبلی به صورت آپشنال بود، در حال حاضر استاندارد است که باعث بهینه سازی هزینه ها می شود.

تمامی این ویژگی ها به همراه خدمات دستگاه طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX که به واسطه ی شرکت HITACHI در سراسر دنیا انجام می گیرد، خرید دستگاه طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX، از این شرکت را به گزینه ای بی رقیب تبدیل کرده است. برای اطلاع از قیمت دستگاه طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX با شماره درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.

ویژگی های دستگاه فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX

• اندازه گیری با سرعت بالا

دستگاه آنالیز طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX ، باعث سرعت بخشیدن به زمان اندازه گیری آنالیز شده که برای نمونه های فلزی یک دهم و برای نمونه های پلاستیکی یک سوم زمان نسبت به مدل معمولی SEA1000AII کاهش یافته است. این امر باعث افزایش عمق بیشتر می شود.

توجه: زمان اندازه گیری کل به عنوان زمان مورد نیاز برای رسیدن به حد تشخیص ۲۰ ppm برای Cd و ۱۰۰ ppm برای عناصر دیگر (که تحت شرایط توصیه شده High Tech فن آوری هیتاچی اندازه گیری می شود) تعریف می شود.

Cd, Pb, Hg, Br, Cr in plastics	Cd, Pb, Hg, Cr in high concentration BrSb plastics	Cd, Pb, Hg, Br, Cr in brasses	
EA1200VX	Approximately 30 sec	Within 120 sec	Within 200 sec
SEA1000AII	Approximately 100 sec	Within 360 sec	More than 2,000 sec

Table.1 Measurement time using the EA1200VX and SEA1000AII.

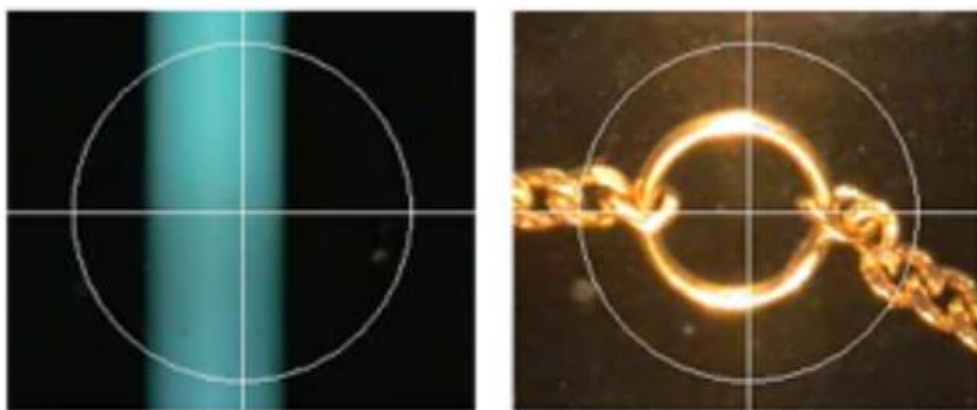
• آشکارساز سرعت سنج سریع

دستگاه آنالیز طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX با سرعت سنجش سریع "Vortex" تجهیز شده است که با سرعت ۱۵۰۰۰۰ CPS شناسایی می کند و نیازی به LN2 ندارد و در نتیجه رد سطح بی سابقه ای از دقت و حساسیت قرار دارد.

• نسخه جدید نرم افزار با قابلیت اندازه گیری مواد خطرناک



دستگاه آنالیز طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX به سرعت مواد مختلف انواع نمونه ها را شناسایی می کند. و این دستگاه XRF بدون نیاز به دستور العمل تحلیلی می تواند به طور خودکار یک ماده را شناسایی کند.



• بهبود پنل عملکرد

کاربر دستگاه آنالیز طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX می تواند وضعیت اندازه گیری را از طریق نوار پیشرفت در پنل عملیات و نیز شاخص های صدا کنترل کند.



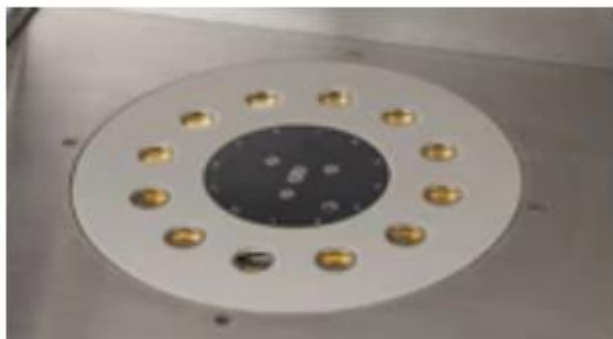
مواد مرجع استاندارد برای مقررات محیط زیستی مختلف (اختیاری)

در دستگاه آنالیز طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX، انواع نمونه های مرجع استاندارد توسعه یافته و تولید شده و در دسترس هستند. اینها نه تنها برای عناصر منحصر هم چون (Pb، Cd، Hg، Br و Cr)، بلکه برای عناصر دیگر مانند کلر و آنتیموان و قلع و ... وجود دارد.



قابلیت تغییر نمونه (اختیاری)

در دستگاه آنالیز طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX، قابلیت تغییر مداوم نمونه ها تا ۱۲ نمونه وجود دارد.



مدیریت داده ها با Hazardous Substance Measurement Software Ver.2

در دستگاه آنالیز طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX، نرم افزار توانایی مدیریت داده ها (بازیابی، مرور، تجزیه و تحلیل، ویرایش، چاپ و ...) با یک یا چند ابزار را دارد و امکان کاهش قیمت و افزایش کارایی را دارد.

کاربردهای دستگاه فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX

۱. دستگاه فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX آنالیز عنصری فلزات و فلزات همچنین عناصر منحصر هم چون (Cd, Pb, Hg, Br و Cr)، و برای عناصر دیگر مانند کربن و آنتیموان و قلع و ... وجود دارد.
۲. بهبود حساسیت تشخیص فلزات سنگین در ذرات هوا توسط طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس XRF | دستگاه آنالیز فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX قابل اندازه گیری است.
۳. تجزیه سریع سطح پایین و متوسط سرب، آرسنیک و غیره در هوا توسط دستگاه فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX قابل اندازه گیری است.
۴. طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس XRF | دستگاه آنالیز فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX کاربرد فراوانی در صنایع سیمان و فولاد دارد.

مشخصات فنی دستگاه فلورسانس اشعه ایکس (XRF) مدل EA1200VX

Measurable Elements	Atomic Number: 13 (Al) to 92 (U)
Sample state	Solid / Powder / Liquid
X-ray tube	X-ray tube (Rh target) Voltage: 15 kV, 50 kV Current: 1 mA (10 μ A to 1,000 μ A variable)
Type	Bottom-up Irradiation
Detector	Vortex® (SDD) *No liquid nitrogen required
Measurement Area	1 mm ϕ 、 3 mm ϕ 、 5 mm ϕ (Electric switching)
Sample Observation	Color CCD camera
Sample Chamber	370(W) $\times$ 320(D) $\times$ 120(H) mm
Filter	5 filters automatic switching (including OFF)
Operation	Laptop or Desktop PC
Software	X-ray Station Qualitative functions: Spectrum measurement, Auto-ID, KLM marker display, Comparison display) Quantitative functions: Bulk CAL, Bulk FP Routine measurement Hazardous Substance Measurement Software Ver.2

Data Processing	Microsoft Excel, Microsoft Word
Utility	AC 100 V to 240 V $\pm 10\%$, Single phase
Accessory	Sample Cup 2 types for liquid and tiny samples

Options

- Film FP
- Film CAL
- Spectrum Matching Software (Material Discrimination)
- Hazardous Substance Measurement Software Ver.1
- Standard Reference Samples (for various environmental regulations, lead-free solder, and lead-free solder film)
- Signal tower
- Printer (for Japan)
- * "Microsoft", "Excel" and "Word" are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.